

Laboratorio di Fisica - A.A. 2020/2021

Docenti: A. Garfagnini - M. Lunardon

Fotodiodo

Cerrone Vanessa

1200361

vanessa.cerrone@studenti.unipd.it

Cigagna Simone

1193992

simone.cigagna@studenti.unipd.it

Lai Nicolò

1193976

nicolo.lai@studenti.unipd.it

1 Introduzione

Si vuole analizzare lo spettro dei fotoni emessi dall'Americio-241 con un rivelatore al Silicio tipo PIN, dotato di preamplificatore di carica. L'hardware, cioè i moduli di elettronica, sono stati pre-impostati in condizioni standard, con shaping time pari a $3\mu s$, in modo da ottimizzare il rapporto segnale rumore. Preliminarmente, tramite il software di acquisizione, si registra uno spettro per identificare i picchi principali, a 60keV e 14-18keV.

Nella Sez. 3 si analizzerà il picco a 59.5keV in presenza di materiali di diverso spessore, al fine di calcolare i relativi coefficienti di assorbimento. Nella Sez. 4, si effettueranno misure al variare della distanza della sorgente, per verificare che i dati seguano l'andamento atteso. Un'analisi dettagliata dello spettro verrà presentata nella sezione Sez. 2.2.

2 Spettro dell'Am-241

Prima di studiare in dettaglio gli effetti di diversi assorbitori posti tra la sorgente ed il detector ed il ruolo che svolge la distanza di quest'ultimo dalla prima, ci si vuole concentrare in un'analisi dello spettro dell'Americio-241. Sperimentalmente, il rivelatore viene posto alla minima distanza dalla sorgente e non viene inserito alcun assorbitore tra i due. Il tempo di acquisizione viene impostato a 600s, rivelando così approssimativamente $2 \cdot 10^5$ eventi con un rate istantaneo di circa 340Hz. In questo modo, il picco a 60keV presenta una precisione $\sqrt{N}/N \approx 1.5\%$.

2.1 Calibrazione e Risoluzione Energetica

Inizialmente, si vuole calibrare l'asse orizzontale riconoscendo nello spettro in Fig. 1 il picco a 60keV. Nel grafico è presentato lo spettro di emissione con l'asse calibrato in energia: per ottenere tale risultato è stato eseguito un fit gaussiano del picco, come mostrato nel riquadro all'interno del grafico. Ovviamente, la calibrazione ot-

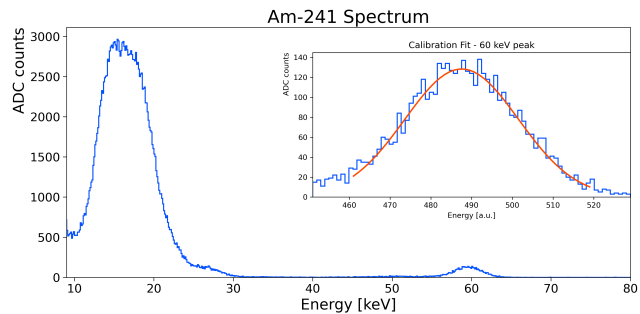


Fig. 1: Spettro dell'Americio-241 con fit del picco a 60 keV per la calibrazione dell'asse orizzontale

tenuta sfruttando unicamente il picco a 60keV e assumendo l'assenza di un possibile offset è approssimata, tuttavia risulta essere sufficiente per gli scopi dell'esperienza.

Dal fit del picco a 60keV è possibile infine estrapolare una stima approssimata della risoluzione energetica R:

$$R = \frac{\Delta E}{E} \approx \frac{FWHM}{\text{mean}} = 6.75\% \quad (1)$$

in assenza di offset

2.2 Fit Multi-Picco

Ci si propone ora di costruire un fit complessivo di tutto lo spettro raffigurato in Fig. 1. Ci si concentra unicamente sulle emissioni di raggi X e gamma con un'intensità di almeno 2 fotoni ogni 100 disintegrazioni: in Tab. 1 sono riportati quindi i contributi considerati con le relative probabilità di emissione. Per ciascuno di questi, si costruisce una funzione gaussiana con media fissata in quanto l'energia è nota (Tab. 1) e l'asse orizzontale è stato preliminarmente calibrato. La larghezza della gaussiana (sigma), invece, si compone di due contributi in somma quadratica: il primo è una componente fissa, di rumore, che verrà denotata come η , mentre il secondo è la componente di risoluzione intrinseca

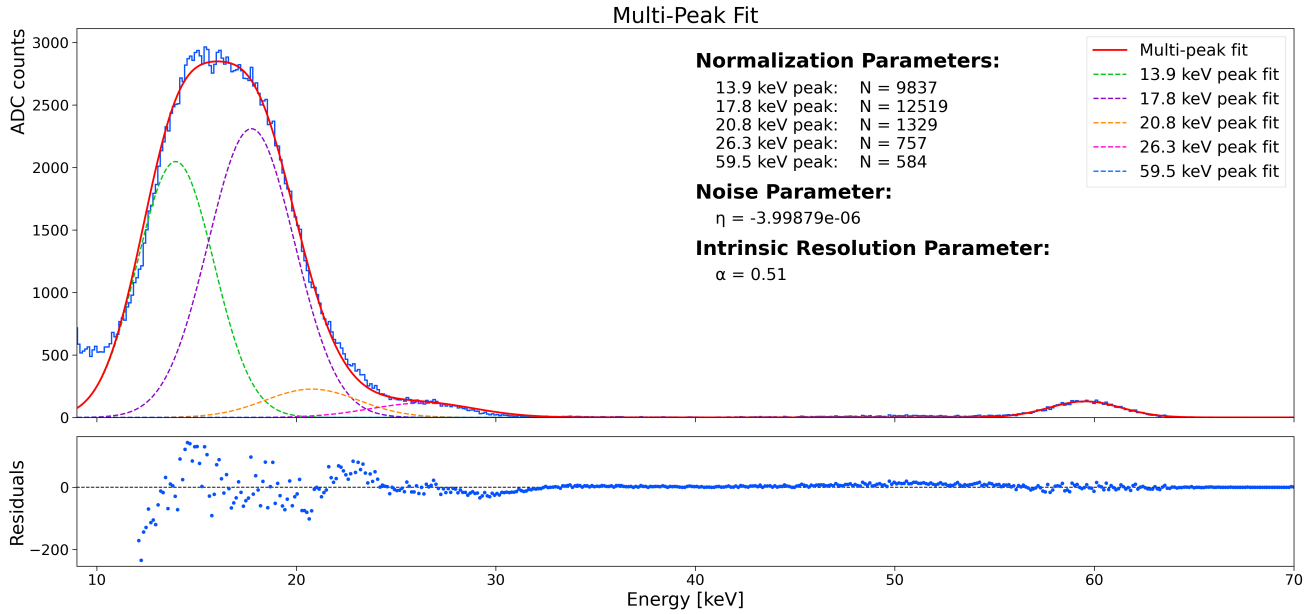


Fig. 2: Fit multi-picco dello spettro dell'Americio-241

α proporzionale alla radice quadrata dell'energia del fotone preso in considerazione.

Il fit viene effettuato minimizzando un χ^2 composto dalla somma quadratica dei singoli χ^2 dati da ciascun contributo gaussiano, ottenendo in questo modo quanto raffigurato in Fig. 2. In particolare, sono stati scelti come parametri liberi il contributo di rumore η e di risoluzione intrinseca α , assieme ai fattori di normalizzazione $\{N_i\}$ relativi ad ogni singolo picco considerato. Osservando quindi il grafico in Fig. 2, la curva in rosso rappresenta il fit complessivo dello spettro: questa segue in modo più che soddisfacente il profilo delle emissioni dell'Am-241. Le curve tratteggiate, invece, corrispondono ai singoli contributi gaussiani considerati per effettuare il fit: risulta quindi evidente che il potere risolvante dell'apparato non è sufficiente per identificare tali contributi singolarmente. Dal grafico dei residui, relativi al fit complessivo, si può notare una certa difficoltà nel seguire in modo fedele il profilo del primo picco, in quanto composto da numerosi contributi. Il picco a 60 keV, invece, risulta in maggiore accordo con la funzione di regressione.

3 Coefficiente di assorbimento

Ci si propone di effettuare delle misure in presenza di materiali di diverso spessore, nello specifico rame e argento, con lo scopo di calcolarne il coefficiente di assorbimento μ , che si ricava dalla relazione:

$$I(x) = I_0 e^{-\mu x} \quad (2)$$

dove I è l'intensità della radiazione incidente e x lo spessore attraversato. In particolare, si vuole fornire una stima del coefficiente di assorbimento massivo, definito come:

$$\mu_p = \frac{\mu}{\rho} \quad (3)$$

Probabilità di Emissione	
Energia [keV]	Prob. (%)
13.9	11.60 (12)
17.8	11.83 (12)
20.8	2.94 (3)
26.3	2.31 (8)
59.5	35.92 (17)

Tab. 1: Energie dei fotoni considerati nel fit multi-picco e relative probabilità di emissione

con ρ densità del materiale, che è pari a $10.49 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ per l'argento e $8.96 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ per il rame.

Si inseriscono gli assorbitori di spessore variabile e si acquisiscono gli spettri per un intervallo di tempo sufficiente a garantire una precisione migliore del 3% sul picco a 59.5 keV. La precisione in percentuale si ottiene ricavando il numero di eventi N , cioè l'area, al di sotto del picco di interesse, come \sqrt{N} . Si calcola il rate degli eventi nel picco a 60 keV per tutte le misure effettuate come rapporto tra numero di eventi rilevati e tempo di acquisizione, che come prima è stato adattato in modo da avere precisioni di almeno il 3%. Considerando la relazione Eq. 2 si effettua un fit del rate in funzione dello spessore del materiale, separatamente per rame e argento. Si sottolinea che il rapporto N/t rappresenta l'intensità della radiazione incidente per unità di superficie: il rivelatore a disposizione ha un'area di 1 cm^2 , dunque il fit restituisce parametri dimensionalmente corretti. (?)

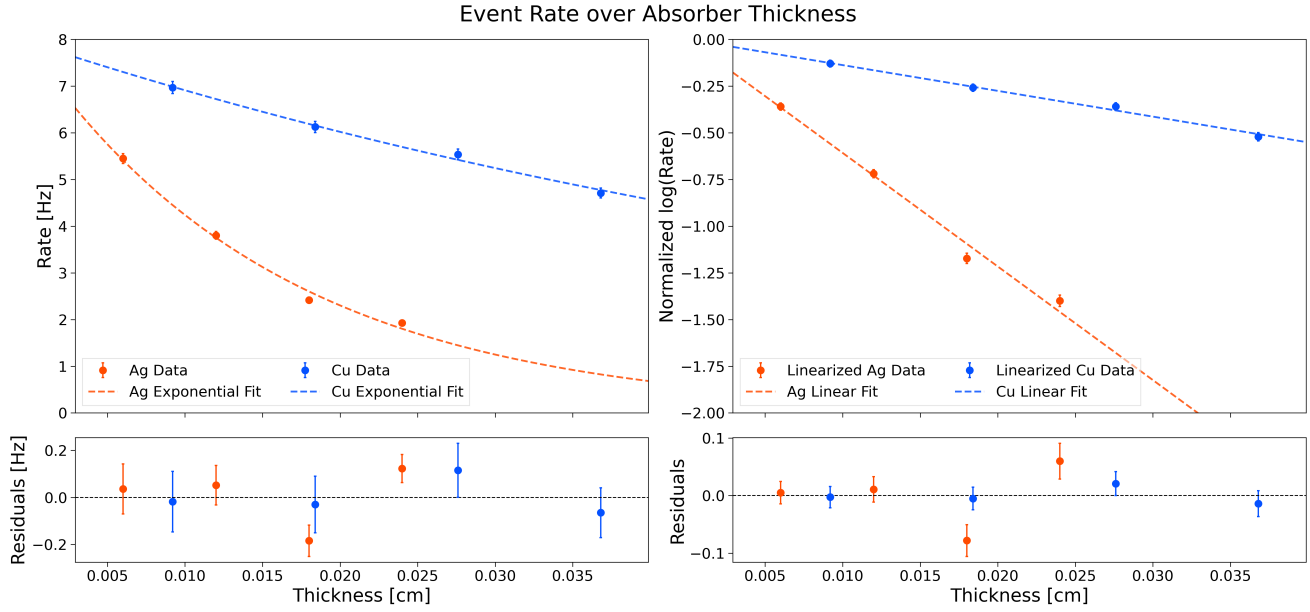


Fig. 3: A sinistra fit esponenziale, a destra fit linearizzato per il calcolo dei coefficienti di assorbimento

Ag		Cu	
Spessore [μm]	Rate [Hz]	Spessore [μm]	Rate [Hz]
60	5.45 ± 0.11	92	6.97 ± 0.13
120	3.80 ± 0.08	184	6.12 ± 0.12
180	2.42 ± 0.07	276	5.54 ± 0.11
240	1.93 ± 0.06	368	4.71 ± 0.11

Tab. 2: Dati fit esponenziale per il calcolo del coefficiente di assorbimento

Si riportano in Tab. 2 i dati utilizzati per l'interpolazione, con errore sulle ordinate calcolato per propagazione, trascurando le incertezze sui tempi di acquisizione. Infatti, alla luce del fatto che i valori dei tempi di acquisizione mostrati sull'interfaccia del software si discostavano sensibilmente da quelli impostati manualmente, si è assunto un errore massimo di 0.1s, ed è stato preliminarmente verificato che tale contributo avesse un peso relativo trascurabile. Si vuole inizialmente effettuare un fit esponenziale del tipo $y = I_0 e^{-\mu x}$. Successivamente, sfruttando il parametro I_0 per normalizzare i dati, si vuole considerare il logaritmo delle intensità normalizzate ed effettuare una regressione lineare con la retta di equazione $y = mx$. In questo modo, quindi, i dati si distribuiscono secondo $\log(I/I_0) = -\mu x$, con errore sul logaritmo ottenuto per propagazione.

4 Legge dell'Inverso del Quadrato della Distanza

Ci si propone ora di verificare la cosiddetta "legge dell'inverso del quadrato della distanza". In particolare, si vuole controllare che il rate dei raggi X (ovvero il primo

picco a sinistra in Fig. 1) segua un andamento proporzionale all'inverso della distanza al quadrato tra sorgente e detector. In assenza di assorbitori tra i due, quindi, vengono acquisiti una serie di spettri facendo variare la posizione del rivelatore. Dagli spettri acquisiti viene calcolato il rate degli X: tali valori, assieme alla posizione del detector, sono riportati in Tab. 3. Questi vengono quindi raffigurati in Fig. 4: si vuole far notare in particolare la presenza di un parametro x_0 di zero. Infatti, tramite il software per la movimentazione del detector è possibile unicamente impostarne la posizione lungo una rotaia: l'effettiva distanza con la sorgente è invece ignota a priori in quanto la posizione della sorgente non corrisponde allo zero del sistema di riferimento utilizzato dal software per posizionare il detector sulla guida.

Per la verifica della legge dell'inverso del quadrato della distanza si vuole quantificare la bontà del fit: il χ^2 risulta sensibilmente maggiore rispetto ai gradi di libertà (compatibilità $Z = 3$). Tuttavia, siccome nel caso in questione non sono stati considerati numerosi effetti ulteriori e, possibilmente anche a causa dello scarso potere risolvante dell'apparato, l'incertezza sul rate di rivelazione può essere stata (leggermente) sottostimata. In questo caso, dunque, una compatibilità $Z = 3$ con i gradi di libertà non è da considerarsi pessima: osservando il grafico dei residui, infatti, si osserva un soddisfacente andamento attorno allo zero. Si può quindi concludere che le misure acquisite al variare della distanza tra sorgente e detector seguono piuttosto fedelmente un andamento proporzionale all'inverso della distanza al quadrato.

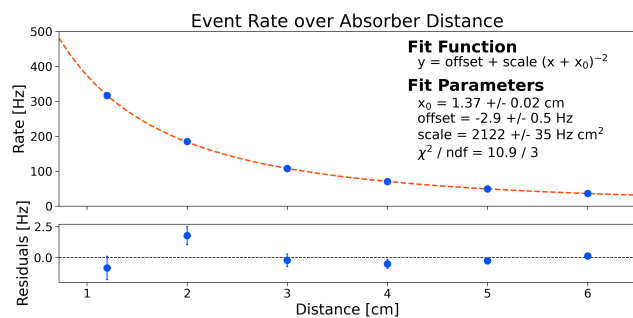


Fig. 4: Rate di rivelazione dei raggi X in funzione della distanza tra sorgente e detector

Rate in funzione della posizione	
Posizione [cm]	Rate [Hz]
1.2	316.4 ± 0.9
2.0	185.2 ± 0.7
3.0	107.8 ± 0.5
4.0	70.1 ± 0.4
5.0	49.1 ± 0.3
6.0	36.2 ± 0.2

Tab. 3: Posizione del detector con associato il relativo rate di rivelazione